

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2001年4月26日 (26.04.2001)

PCT

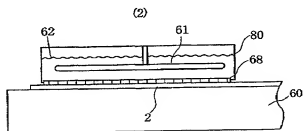
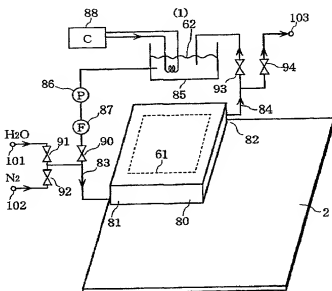
(10) 国際公開番号
WO 01/29807 A1

- (51) 国際特許分類: G09F 9/00, G02F 1/136 (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 松下電器産業株式会社 (MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒571-8501 大阪府門真市大字門真1006番地 Osaka (JP).
- (21) 国際出願番号: PCT/JP00/07250 (72) 発明者; および (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 川崎清弘 (KAWASAKI, Kiyohiro) [JP/JP]; 〒573-1118 大阪府枚方市楠葉並木1-8-3 Osaka (JP).
- (22) 国際出願日: 2000年10月18日 (18.10.2000)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願平 11/299655 1999年10月21日 (21.10.1999) JP
特願平 2000-107577 2000年4月10日 (10.04.2000) JP (81) 指定国 (国内): KR, US.

[続表有]

(54) Title: INSPECTION AND REPAIR OF ACTIVE SUBSTRATE

(54) 発明の名称: アクティブ基板の検査と修復



(57) Abstract: Pin holes in an insulation layer on a conductive pattern are identified and repaired by a simple means and device using the following methods, with a trend seen that the substrates of liquid crystal display devices are increasing in size. 1. A chemical is allowed to stay and held in a particular area on a substrate, and an electrode plate is allowed to contact or approach the chemical to permit an electric treatment by a sheet and a pin hole inspection. Four types of chemical holding mechanisms are available. 2. The chemical is treated in a measure-like container to prevent the occurrence of chemical mist. 3. An insulating element formed by anodic oxidation or the like is used to bury an insulating layer on a conductive pattern. 4. Scanning lines (and common capacity lines and/or counter electrodes) in a pin hole are inactivated by electrochemical treating.

[続表有]

WO 01/29807 A1